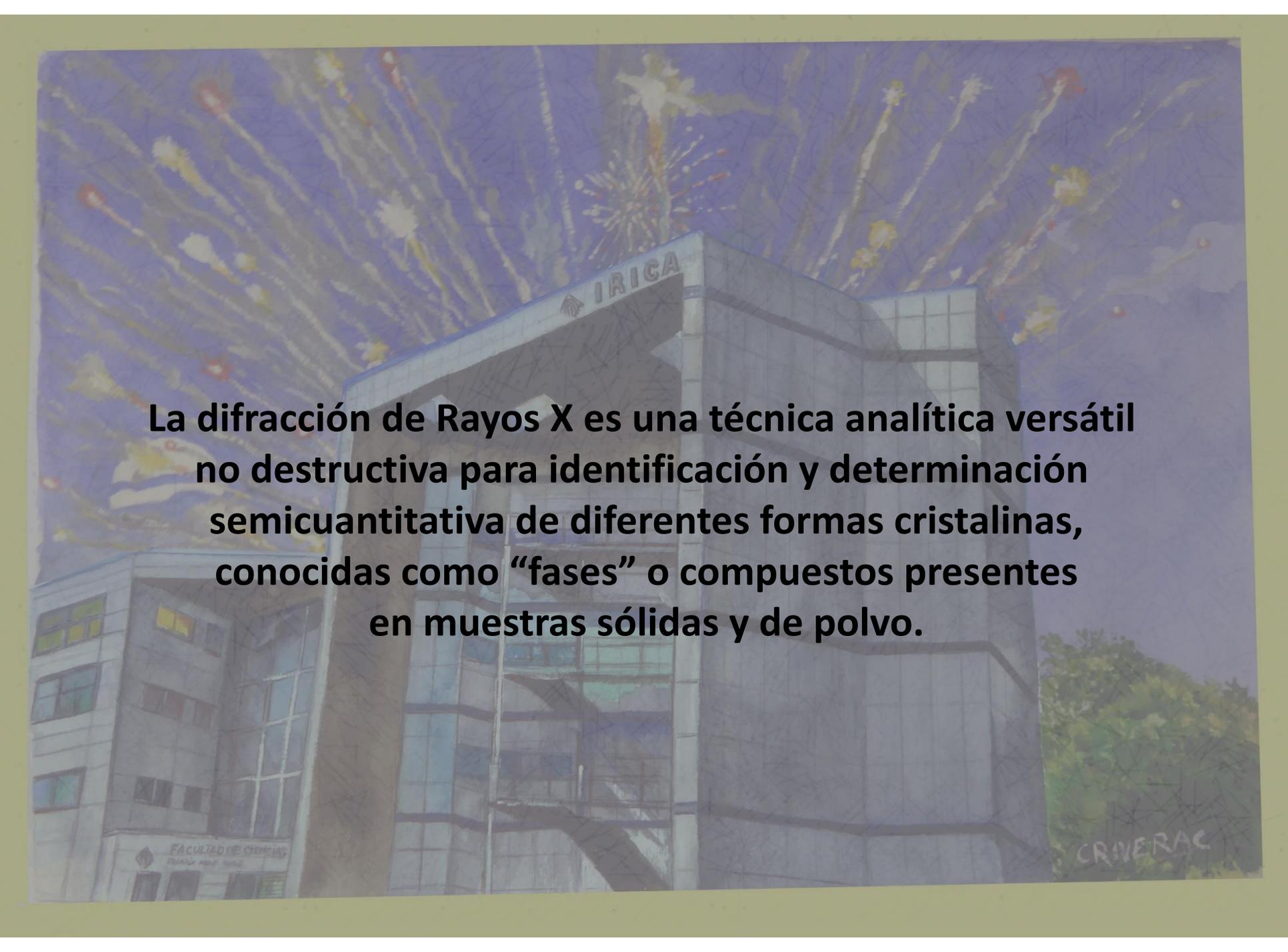


DIFRACCIÓN DE RAYOS X



PHILIPS X'PERT MPD



La difracción de Rayos X es una técnica analítica versátil no destructiva para identificación y determinación semicuantitativa de diferentes formas cristalinas, conocidas como “fases” o compuestos presentes en muestras sólidas y de polvo.

The background of the slide is a photograph of a modern building with a grid-like facade. The word 'AMERICA' is visible on the upper part of the building. In the sky above the building, there are several colorful fireworks exploding. The overall scene is set against a dark, twilight sky. The text is overlaid on the left side of the image.

DIFRACTÓMETRO PHILIPS X'PERT MPD

Tubo Cerámico con ánodo de Cobre

Radiación $K\alpha_1 = 1,54056 \text{ \AA}$

Rendija de divergencia programable

Fija o automática- Entre 0,5 y 20 mm

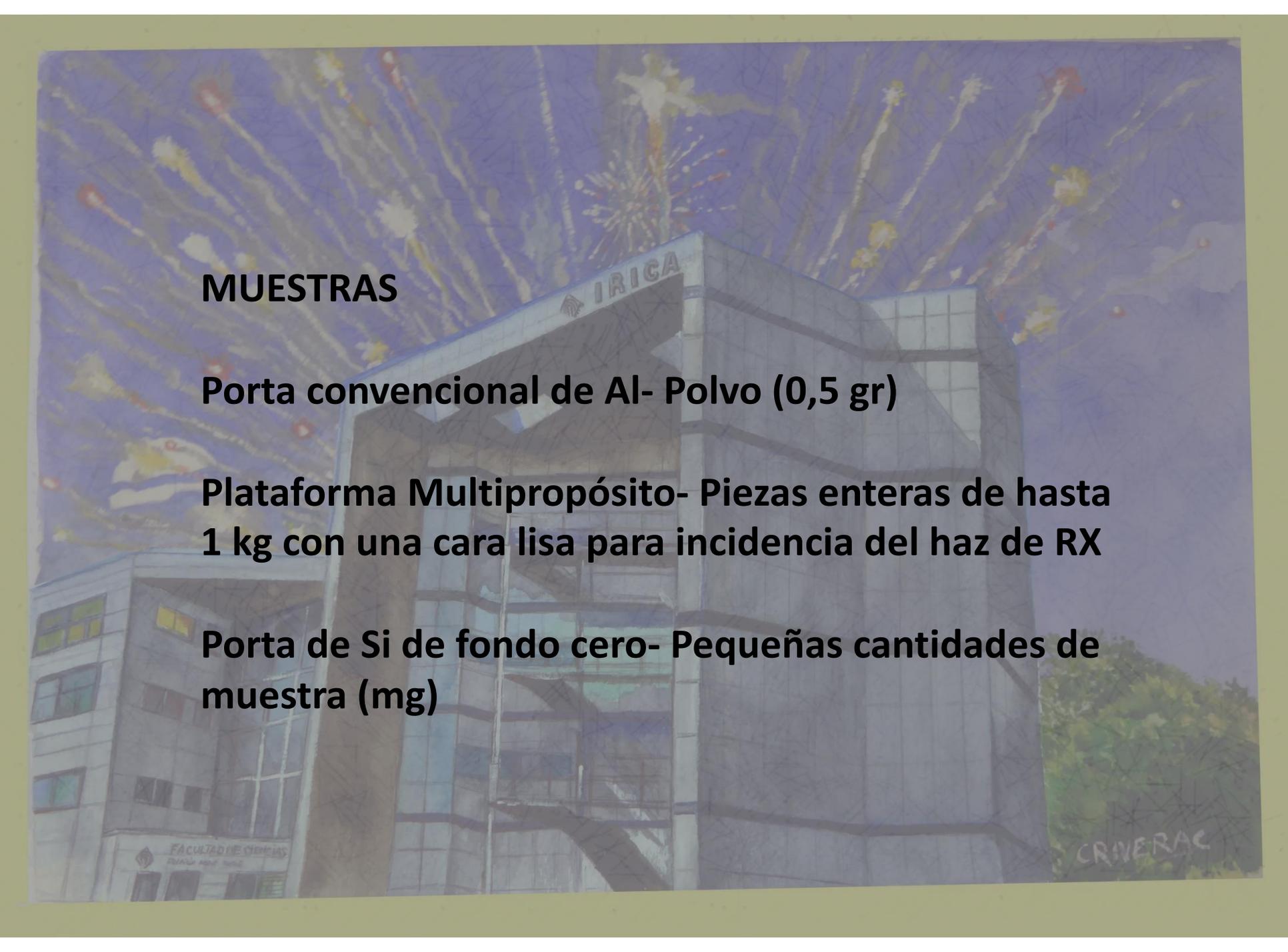
Goniómetro- Precisión $0,001^\circ$ 2 Theta

Rendija Antiscatter

Rendija de Recepción

Monocromador de grafito para la $CuK\alpha_1$

Detector proporcional sellado de gas (Xenón)



MUESTRAS

Porta convencional de Al- Polvo (0,5 gr)

Plataforma Multipropósito- Piezas enteras de hasta 1 kg con una cara lisa para incidencia del haz de RX

Porta de Si de fondo cero- Pequeñas cantidades de muestra (mg)

APLICACIONES

- Identificación y determinación semicuantitativa**
- Determinación semicuantitativa de cantidad de amorfo**
- Determinación de tamaño de partícula cristalina**
- Reflectividad- Para medida de espesor o grosor de la lámina o película delgada**

